論 文

SS-316 ステンレス鋼のトリチウムの除染(II) 除染に与える水の影響

鳥養祐二¹⁾, A. Perevezentsev²⁾, 松山政夫¹⁾, 渡辺国昭¹⁾ 1) 富山大学 水素同位体科学研究センター 〒930-8555 富山市五福 3090

2) UKAEA, Culham Science Centre, Abingdon, OX14 3DB, UK

Removal of tritium from stainless steel type 316(II)

- Effect of Water Vapor -

Y. Torikai^{1),} A. Perevezentsev²⁾, M. Matsuyama¹⁾ K. Watanabe¹⁾,

 Hydrogen Isotope Research Center, Toyama University, Gofuku, Toyama 930-8555, Japan
UKAEA, Culham Science Centre, Abingdon, OX14 3DB, UK (Received November 5, 2002; Accepted December 20, 2002)

Abstract

To establish a decontamination method for stainless steel type-316 (SS-316) contaminated by tritium, desorption behavior of tritium caused by heating was examined. When tritium was exposed to a temperature at 523 K for 3 hours, tritium inventories in the SS-316 samples were in the range of 2 to 12 MBq. The tritium depth profiles obtained from BIXS measurements showed that tritium diffused to a depth of more than 70 μ m. Decontamination tests on tritium were carried out at elevated temperatures by purging with commercial argon, argon dried by a getter and argon containing water vapor. The presence of water vapor in the argon atmosphere was found to necessary for tritium decontamination from SS-316 samples. The result suggested that an isotope exchange reaction with water vapor adsorbed on the surface plays an important role in the decontamination of tritium. It was concluded that not only tritium adsorbed on the surface but also that dissolved in the bulk can be removed by heating.

1 緒 言

核融合炉開発研究の進展に伴い,トリチウム汚染材料が蓄積の一途をたどっている.そのため,トリチウム除染法の開発が急務となっている.特にステンレス鋼は核融 合炉本体の構造材や配管等の最有力候補であり,ステンレス鋼の除染技術の早期確 立が強く求められている¹⁾.この課題に対して,これまでにステンレス鋼でのトリチウム の吸着・脱離反応,拡散,透過等の基礎過程の研究^{2,3,4,5)},及び除染法自体^{6,7,8)}の研 究が進められてきている.しかしながら,前者に関してはデータのばらつきが大きく, 材料のトリチウム汚染及び除染過程を定量的に記述できる段階には至っていないの が現状である.また,後者に関しては,そのほとんどが表面の除染に注目したもので あり,材料のバルク領域までの除染を対象とした研究はきわめて少ない.水素同位体 の常として,トリチウムの金属中での拡散は早く,汚染材料のバルク領域に存在するト リチウム量は表面に存在するものに比べて圧倒的に多いことを考慮すれば,バルク領 域までを含む除染の重要性は明らかである.

このような観点より,著者らはトリチウムをその内部まで溶解させたステンレス鋼を用 い,様々な雰囲気における加熱処理の除染効果を調べ,雰囲気気体中の水蒸気が 表面のみならずバルク領域の除染にも重要な役割を果たすことを見いだした⁹⁾.本論 文では,SS-316 ステンレス鋼の除染試験の詳細と,その除染効果に対するアルゴン ガス中の水蒸気の影響を詳細に調べた結果を報告する.

2 実 験

2.1 試料

実験材料としてニラコ社製の SS-316 ステンレス鋼を用いた. PHILIPS 社製蛍光 X 線分析装置 pw2300 x-ray spectrometer により求 めた組成を Table 1 に示す. 試料の サイズは 15×15×0.5mm とした. 試 料の前処理として, イオン交換水お よびアセトン中で超音波洗浄機を用 いて洗浄を行った. Fig. 1 に試料表 面の SEM 像を示す.本研究で用い た試料は研磨やエッチング等の特 別な処理は行っていないため, 図に



Fig. 1. SEM picture of SS-316 Stainless steel surface.

示すように試料表面には傷や,粒界に起因すると思われる溝が観察された.

Table 1 Chemical	composition of SS-316
------------------	-----------------------

Element	Fe	Cr	Ni	Мо	Mn
Content(wt%)	69.4	16.2	6.1	1.8	0.8

2.2 トリチウムの暴露

トリチウムの暴露はFig. 2 に示す高真空 装置を用いて行った.試料を石英製の反 応菅に入れ,前処理として 373K~673K の間で,50K刻みに昇温し,各温度で 10⁻⁶Pa台の真空度に達するまで排気を行 った.その後,装置内の残留ガス(水分)を 十分に排気するため,1~2 日間イオンポ ンプを用いて排気した後,トリチウムの暴 露を行った.トリチウムの暴露は,32%のト リチウムを含む水素-トリチウム混合ガスを 用いて,温度 523K,または 573K,圧力 1.2 kPaで3時間行った.暴露後,トリチウ ムをゲッタ中に回収し,イオンポンプで1 週間排気を行った後,除染試験に用いた.



Fig. 2. The schematic diagram of the apparatus for exposure of SS-316 specimen to tritium. QMS:quadropole mass spectrometer, IG:ionization gauge, CM:capacitance manometer, SIC:small ionization chamber, RP:rotary pump, TMP:turbo moleculer pump, SIP:sputter ion pump.

2.3 除染試験

Fig. 3 にトリチウム除染試験装置の概略を示す、装置はゲッタと水バブラーを装備したガス供給部,石英製の試料加熱部,二つの水バブラーと CuO 反応管を装備したトリチウム回収部の三つで構成されている.これらはステンレス管により接合した.試験中は配管を 400K に加熱し,試料より脱離したトリチウムが装置内に残留するのを防いだ.

試料の除染には不活 性ガス流通下加熱法を 採用した.その際の加熱 温度は353~573Kで,キ ャリアガスとして,日本酸 素株式会社製高純度ア ルゴンガスを使用した.



Fig. 3. Experimental apparatus used for decontamination tests.

その純度は、保証値 99.9999%以上、不純物としてN₂:<0.3ppm,O₂:<0.1ppm,CO: <0.1ppm,CO₂:<0.1ppm,CH₄:<0.1ppm,H₂:<0.2ppm,およびH₂Oを 0.073Pa含む. 本実験ではボンベより直接除染装置に導入したガス(as-received Ar,以下:asr-Ar), 装置に供給する前にZr-V-Mnゲッタを用いて乾燥させたもの(以下:dry-Ar)、及び水 バブラーを用いて 2.6kPaの水を含ませたもの(以下:wet-Ar)の3種類を使用した、ガス 流量は 100cc/minとした.

試料から放出された水蒸気状のトリチウム(以下:HTO)は,最初の水バブラーで, 試料から元素状で脱離したトリチウム(以下:HT)は CuO により酸化した後水バブラー で捕集した.なお,除染試験後,試料を1073Kで1時間加熱し試料中のトリチウムを全 て脱離させ,試料中に残留したトリチウム量を測定した.試料に導入したトリチウムの総 量は脱離したトリチウムの総和より求めた.バブラー通過後のガス中のトリチウムの残 量を調べるため,イオンチャンバーを用いて,系外へのトリチウムの放出量をモニター した.水バブラーに捕集されたトリチウム量はアロカ社製液体シンチレーションカウンタ ーLB-1 或いは LB-5 を用いて測定した.

2.4 トリチウム分布の測定

試料内部のトリチウムの分布は, 線誘起X線計測(BIXS)法¹⁰⁾およびエッチング法 により求めた.BIXS測定は,CANBERRA社製GUL005Pゲルマニウム半導体検出器 を用いて,アルゴン雰囲気中で行った.得られたスペクトルを解析しトリチウムの内部 分布を求めた.その際,SS-316の組成として表1の値を,SS-316およびArの質量吸収 係数にはTable 2 に示す値を用いた¹¹⁾.Table 2 に示したµ1及びµ2 は,それぞれの原 子に固有なエネルギー領域における質量吸収係数を示している.この計算法の詳細 はすでに松山らによって報告されている¹⁰⁾.エッチングには50%-王水をもちい,エッチ ング層の厚さは,試料の重量変化より求めた.この値と王水中に溶出したトリチウム量 よりエッチング層中のトリチウム濃度を算出した.なお,王水中のトリチウム濃度は,溶 液を100 倍に希釈した後,液体シンチレーションカウンターを用いて測定した.

Table 2 Mass absorption co	efficients ($\mu 1$ for K _a	and $\mu 2$ for K _B in cm ²	² /g) of constitutes of SS-	316 and argon.
···· · · · · · · · · · · · · · · · · ·			0/	

Elements	Fe	Cr	Ni	Mo	Fn	Ar
μ1	13939E-2.8304	9850E-2.7832	14700E-2.7236	6337E-2.5676	11298E-2.7992	3350E-2.7104
μ2	98409E-2.7384	111571E-2.8703	114183E-2.7171	509549E-2.7595	124652E-2.8730	40519E-2.8169

3 結 果·考 察

3.1 暴露試料中のトリチウムの分布

除染試験に用いたトリチウム暴露試料中でのトリチウムの深さ方向分布をBIXS法に より求め,更にエッチング法により確認した.BIXS測定の一例として,573Kで3時間トリ チウムに暴露した試料の,装置から取り出し直後に測定したスペクトルをFig.4に示す. 図の横軸はエネルギー,縦軸はゲルマニウム半導体検出器の単位時間あたりのカウ ント数である.図中,白抜きのプロットは実測値,実線はシミュレーションによって得ら れた計算結果である.なお,図に示した試料は,11.6MBqのトリチウムを含んでいる. 図の様にスペクトルは幅広で強度の弱い制動X線スペクトルと,鋭い特性X線のピーク より構成されている.この中で,3つの強度の大きいピークはAr(Ka),Cr(Ka)及び Fe(Ka)の特性X線である.これらのピークの中で,Ar(Ka)は試料表面のトリチウム量を 反映している¹⁰⁾.また,シミュレーションの結果によれば,Cr(Ka)およびFe(Ka)は8~ 10µm近傍のトリチウム量を,制動X線は70µm付近までのトリチウム量を示している.

Fig. 4に実線で示したスペクトルは、この試料のトリチウムの深さ方向分布がFig. 5に 示すようであると仮定したときに得られたシミュレーション結果で、実測スペクトルときわ めてよく一致した.更に本研究では、この試料中でのトリチウム分布をエッチング法で も確認した.Fig. 6はその結果であり、BIXS法で得られた深さ方向分布と同一パターン の深さ方向分布が観測され、BIXS法による深さ方向分布の妥当性が確認された.こ れらの結果は、更に表面から数µm以内にトリチウム濃度の高い領域が存在し、それ以 下のバルク領域ではトリチウムが均一に分布していることを示している.即ち、上に述



Fig. 4. Observed BIXS spectrum for SS-316 specimen loaded with tiritium of 11.6MBq and the spectrum obtained by simulation.

べた暴露条件ではトリチウムが内 部まで拡散し,溶解平行に達して いることが知られた.

3.2 トリチウムの除染

Fig. 7は,トリチウム量がそれぞ れ約5MBqの試料をasr-Ar中で加 熱したときのトリチウムの脱離挙動 を示している.図の横軸は時間, 縦軸はトリチウム残留量の相対値 である.図のようにトリチウムの脱 離速度は温度に大きく依存した. たとえば,353Kで6時間の加熱で はトリチウムは10%しか脱離しない が,573Kでは2時間で97%のトリチ ウムが脱離した.

トリチウムを11.6MBq含む試料 について, 573Kで6時間asr-Ar中 で除染試験を行い、試験後に BIXS測定を行うとともに,王水を 用いて試料を完全に溶解し,試料 中に残存するトリチウム量を求め た.その結果によれば,暴露直後 11.6MBg存在したトリチウムは, 573K,6時間の加熱により230Bg に低下した.このときのBIXSピー クの変化をFig. 8に示す . Fig. 8 (a) はFig. 4に示した加熱前のBIXSピ ークで、トリチウム量が11.6MBgと きのもの, Fig. 8 (b)は加熱後, トリ チウムが230Bqに低下した時のピ ークである.図に示すように加熱 処理により試料表面のトリチウム量 に依存するAr(Kα)のピークは大き <減少した.また,試料内部のトリ チウム量を反映するCr(Kα),



Fig. 5 Depth profile of tritium in SS-316 calculated from Fig.4. Tritium inventory: 11.6MBq.







Fig. 7. Tritium removal curves for SS-316 in asr-Ar.
O: 353K, ▲: 423K, □: 473K, ●: 523K, Δ: 573K.

Counting rate / counts min⁻¹ (ΔE)⁻

Fe(Ka)のピークは完全に消滅し, 制動X線もバックグランドレベル まで低下した.これらのことより, 573K,6時間の加熱処理により 表面に若干のトリチウムが残って いるものの,BIXSによって測定 される範囲にはトリチウムほとん ど存在しないことが確認できた.

以上, BIXS及びエッチングの 知見より, 加熱処理により表面ト リチウムだけでなく内部に存在 するトリチウムも除染できることが 確認できた.

3.3 除染に与える水の影響

トリチウムの除染の律速課程 は、表面からのトリチウムの脱離 であると考えられており,表面反 応を促進させるための種々の方 法が提案されている^{1,5,12,13,14,15)}. その方法の一つとして,水による 同位体交換法が考えられている. そこで、トリチウムの脱離に与え る水の影響を調べるため, asr-Ar, dry-Ar, wet-Arの3種類のキャリ アガスを用いて除染試験を行っ た.その結果をFig. 9に示す.図 の横軸は時間,縦軸は試料中の トリチウム残量である. 図中〇, ◇は353Kの結果, △, ▽, ▲は 573Kの結果,□,▷,■は573K の結果である,また,○,△,□ はasr-Arの結果, ◇, ▽, ▷は





wet-Arの結果, ▲, ■はdry-Arの結果である.図に示すように353K, 423K, 573Kの各 温度においてasr-Arおよびwet-Arの除染速度は,ほとんど同じであった.特に除染速 度の遅い低温では,水分による表面脱離速度の促進効果を期待したが,キャリアガス 中の水分を増加させてもasr-Arと変わらず,促進効果は認められなかった.これに対し, 423K及び523Kでは,asr-Ar及びwet-Arに比してdry-Arの除染速度は明らかに遅い.

Fig. 10 は 573K における三種のガスによる除染効果をまとめたもので,(a)は装荷し たトリチウム量(横軸)とその内の 80%が除染されるまでに要した時間(横軸)との関係, (b)は脱離トリチウムに占める HTO の比率を示している.(a)図に見られるように asr-Ar と wet-Ar の結果は同一直線上に乗ったが, dry-Ar では別の直線関係が見られ,トリチ ウム量の多少に関わらず, asr-Ar 及び wet-Ar に比べ除染効果の低いことを示している. しかし,いずれのガス及びトリチウム装荷量でも脱離するトリチウムの 99.9%以上が HTO の形であった.

平林らは^{14,15)},種々の表面処理を施したSS-316 に関して,室温で長時間トリチウム に暴露した試料中のトリチウムの存在状態を,昇温脱離により検討している.SS-316の He中での昇温脱離では,水蒸気状のトリチウムによるブロードなピークと,3つのHTに よる明確なピークを得ている.それぞれのピークをHTO,HT-1,HT-2,HT-3とした場合, HTOとHT-1 は表面に弱く吸着したトリチウム,HT-2 は表面に強く吸着したトリチウム, HT-3 は内部に拡散したトリチウムであり,HTOはTやOTの形で表面に吸着したトリチ ウムの脱離によって生成すると結論している.これに対し,Fig. 1 に示すような表面処 理を全く行っていないSS-316 を高温でトリチウムに暴露し,内部までトリチウムが十分 に拡散した試料の等温加熱では,内部に存在するトリチウムもHTOとして脱離した.

一般に,金属試料では,表面は酸化膜で覆われており,酸化物上ではトリチウムは TやOTの形で存在していると考えられている^{15,16}.トリチウムのほとんどがHTOとして 脱離すること,気相の水分量が少なくなると除染速度が低下することを考慮すると,表 面からのトリチウムの脱離は気層の水蒸気と表面のTやOTとの間の同位体交換によ って起きていると考えられる.また,内部から表面に拡散したトリチウムは表面酸化物

にトラップされ, T やOT を形成し た後, 気相中の水と同位体交換を 起こして脱離すると考えられる.即 ち, その同位体交換反応が水蒸 気による除去促進効果の主要因と 考えられる.ただし, この場合, ボ ンベに含まれる 0.073Paと非常に 少量の水が存在するだけでも, す でに表面トリチウムと気相の水との 同位体反応は飽和状態にあるとい える.



Fig. 10. Dependence of tritium removal efficiency(a) and the fraction of HTO(b) on the tritium inventory: "t" is the time required for 80% decontamination. O:dry argon, \Box :commercial argon, Δ :wet argon.

5 結 論

内部まで十分にトリチウムは拡散した SS-316 ステンレス鋼について,加熱によるトリ チウムの脱離挙動について検討した.その結果,

- (1) 表面に吸着したトリチウム同様, 内部に存在するトリチウムも加熱により除染できる ことがわかった.
- (2) トリチウムの表面からの脱離は同位体交換によっておきるが, asr-Ar に含まれる 0.073Pqという非常に少量の水蒸気でもすでに交換反応は飽和していることがわかった.

参考文献

- K. Y. Wong, B. Hircq, R. A. Jalbert and W. T. Shmayda, Fusion Engineering and Design, 16 (1991)155.
- T. Tanabe, Y. Yamanishi, K. Sawada and S. Imoto, J. Nucl. Mater., 122 & 123(1984)1568.
- 3) D. M. Grant, D. L. Cumming and D. A. Blackburn, J. Nucl. Mater., 152 (1988)139.
- 4) M. Nishikawa, N. Nakashio, Y. Shiraishi, S. Odoi, T. Takeishi and K. Kamimae, J. Nucl. Mater., **277**(2000)99.
- 5) F. Reiter, K.S. Forcey and G. Gervasini, Cat. No. CD-NA-15217-EN-C, ECSC-EEC-EAEC Brussels, (1993).
- 6) T. Itoh, S. Ueda, K. Tatenuma, Y. Torikai, M. Matsuyama and K. Watanabe, Fusion Engineering and Design, **41**(2002)741.
- 7) A. N. Perevezentsev, K. Watanabe, M. Matsuyama and Y. Torikai, Fusion Engineering and Design, **41**(2002)706.
- 8) A. N. Perevezentsev, K. Watanabe, M. Matsuyama and Y. Torikai, Fusion Engineering and Design, **41**(2002)746.
- 9) Y. Torikai, A. N. Perevezentsev, M. Matsuyama and K. Watanabe, Fusion Engineering and Design, **41**(2002)736.
- M. Matsuyama, K. Watanabe and K. Hasegawa, Fusion Engineering and Design, 39 & 40(1998)929.
- 11) D. R. Lide, CRC Press, 76th edit., p.10-284.
- A. B. Antoniazzi, W. T. Shmayda and R. A. Surette, Fusion Technology, 21(1992)867.
- Y. Oya, K. Kobayashi, W. Shu, T. Higashijima, K. Obara, K. Shibanuma and K. Koizimi, Fusion Technology, 39(2001)867.
- 14). T. Hirabayashi and M. Saeki, J. Nucl. Mater., 120(1984)309.
- 15) T. Hirabayashi, M. Saeki and E. Tachikawa, J. Nucl. Mater., 126(1984)38.

16) D. Stover, H. P. Buchkremer, R. Hecker and H. J. Leyers, J. Nucl. Mater., 122 & 123(1984)1541.